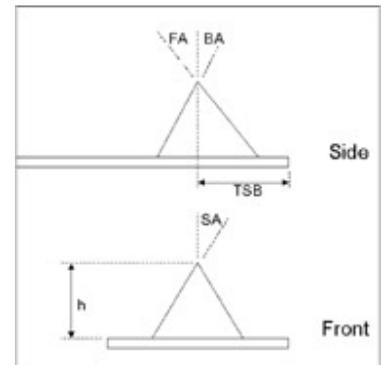
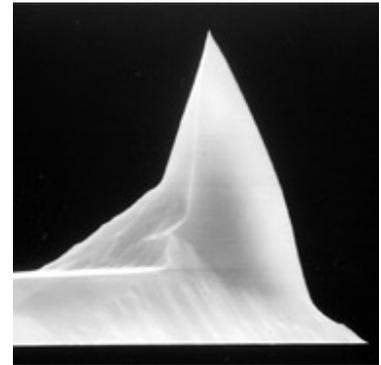


TESP:

Puntas de Silicio para Tapping

Especificaciones de la Punta

Geometría:	Anisotrópico.
Altura de la Punta:	10um - 15um
Ángulo Frontal:	25°
Ángulo Posterior:	15°
Ángulo Lateral:	22.5°
Radio de la Punta (Nom.):	<10nm
Radio de la Punta (máx.):	15nm
Tip Set Back (Nom.):	15um
Tip Set Back (Rng.):	5um a 25um
Compensación de Inclinación de la Punta: 0°	0°
Altura de pico (Nom.):	
Altura de pico (Rng.):	
Ancho del pico:	
Ancho del pico (Rng.):	
Proyección:	
Longitud efectivo de cuello:	



Notas:

Producto de NanoWorld Ltd. Co.

Modelo #	Parte #	Montura	Notas	Cant. /paq.
TESP	TESP	Sin montar		10
TESP7	TESP7	Sin montar		70
TESPW	TESPW	Sin montar		385
1650-00	1650-00	Explorer		8

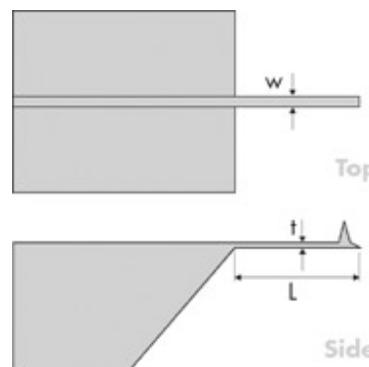
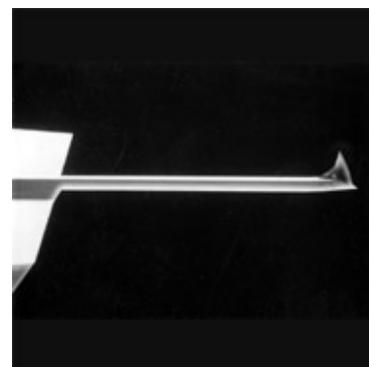
MICRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

TESP:

Puntas de Silicio para Tapping

Especificaciones del Cantilever

Material:	Antimonio (n) doped Si
Espesor, Nominal:	4um
Espesor, Rango:	3.5um a 4.5um
Recubrimiento frontal	
Capa Inferior:	
Capa Superior:	
Recubrimiento Posterior:	



Notas:

Forma	Longitud (um)			Ancho (um)			Frecuencia (Khz.)			k (N/m)		
	Nom.	Min.	Máy.	Nom.	Min.	Máy.	Nom.	Min.	Máy.	Nom.	Min.	Máy.
A Rectangular	125	110	125	30	25	35	320	230	410	42	20	80

MICRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.